

	《计算机学报》文章摘要 全文下载
文章题目	低密度校验码在瑞利衰落信道中的性能分析
作者	孙韶辉 贺玉成 王新梅
作者单位	(西安电子科技大学综合业务网国家重点实验室 西安 710071)
发表年份	2002
发表月份	10期 (页码: 1077—1082)
文章摘要	<p>低密度校验 (LDPC) 码具有编码增益高、译码速度快、可并行译码等特点, 是当前编码界的一个研究热点, 但是目前已有的研究成果都集中在高斯信道上. 该文分析和讨论了LDPC码在瑞利衰落信道下的性能, 应用联合界技术推导了一个规则码的性能限, 并给出了仿真结果, 且发现LDPC码在瑞利衰落信道下也具有非常好的性能. 关键词 低密度校验码, 瑞利衰落信道, 规则码, 非规则码中图法分类号: TP309</p>